

DIN EN 15605:2010-12 (D)

Kupfer und Kupferlegierungen - Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppelter Plasmaanregung; Deutsche Fassung EN 15605:2010

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	6
3 Kurzbeschreibung	6
4 Reagenzien	6
5 Gerät	11
6 Probenahme	11
7 Durchführung	11
7.1 Verfahren A: Kupfer	11
7.2 Verfahren B: Kupfer-Zink-Legierungen	15
7.3 Verfahren C: Kupfer-Zinn-Legierungen	19
7.4 Verfahren D: Kupfer-Aluminium-Legierungen	23
7.5 Verfahren E: Kupfer-Beryllium-Legierungen	27
7.6 Verfahren F: Kupfer-Nickel-Legierungen	31
8 Angabe der Ergebnisse	35
9 Präzision	35
9.1 Verfahren A -- Kupfer	35
9.2 Verfahren B -- Kupfer-Zink-Legierungen	36
9.3 Verfahren C -- Kupfer-Zinn-Legierungen	37
9.4 Verfahren D -- Kupfer-Aluminium Legierungen	38
9.5 Verfahren E -- Kupfer-Beryllium-Legierungen	39
9.6 Verfahren F -- Kupfer-Nickel-Legierungen	40
10 Prüfbericht	40
Anhang A (informativ) Optisches Emissionsspektrometer (OES) -- Zur Überprüfung vorgeschlagene Leistungskriterien	41
Anhang B (informativ) Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppelter Plasmaanregung für die Analyse von Kupfer-Zinn-Blei-Legierungen	43
Literaturhinweise	49